
**Evaluation of thickness, density
and interface width of thin films by
X-ray reflectometry — Instrumental
requirements, alignment and
positioning, data collection, data
analysis and reporting**

*Évaluation de l'épaisseur, de la densité et de la largeur de l'interface
des films fins par réflectrométrie de rayons X — Exigences
instrumentales, alignement et positionnement, rassemblement des
données, analyse des données et rapport*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn